PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-105347

(43)Date of publication of application: 11.04.2000

(51)Int.Cl.

G02B 26/10 B41J 2/44 H04N 1/113

(21)Application number: 10-375098

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

11.12.1998

(72)Inventor: MAKINO HIDEYO

(30)Priority

Priority number: 10229409

Priority date: 29.07.1998

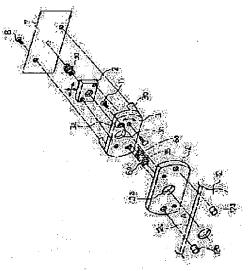
Priority country: JP

(54) MULTIBEAM LIGHT SOURCE DEVICE, MULTIBEAM SCANNER AND IMAGE FORMING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multibeam light source device which makes it possible to obtain a uniform beam spacing and uniform beam shape on an image plane side with respect to respective laser beams by using a semiconductor laser array having plural light emitting points as a light source.

SOLUTION: A collimating lens 35 is housed by fitting or press fitting into a lens barrel. This lens barrel is fixed by adhering or screwing, etc., by aligning the position with respect to the semiconductor laser array 30 in an optical axis direction A to the fitting hole 3b of a rotating base body 3. The lens barrel fixed to the rotating base body 3 fits to the fitting hole 10a of the base body 10 and is adapted to be turnable around the outside diameter 6a of the lens barrel as the center of rotation. Generally, the lens outside diameter and the lens optical axis are suppressed in offcentering with good accuracy. In addition, the outside diameter 6a of the lens barrel and the fitting hole 6b of the collimating lens 35 are subjected to the same working and, therefore, have the concentric accuracy. The center of the outside diameter 6a of the lens barrel and the optical axis A of the collimating lens 35 are eventually exactly aligned.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-105347 (P2000-105347A)

(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

(51) Int.Cl.'		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
G 0 2 B	26/10		G 0 2 B	26/10	В	
					D	
B 4 1 J	2/44		B41J	3/00	D	
H 0 4 N	1/113		H 0 4 N	1/04	104A	

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平10-375098

(22)出願日 平成10年12月11日(1998.12.11)

(31)優先権主張番号 特願平10-229409

(32) 優先日 平成10年7月29日(1998.7.29)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 牧野 英世

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

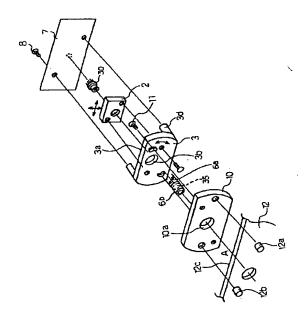
会社リコー内

(54) 【発明の名称】 マルチビーム光源装置、マルチビーム走査装置および画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源として、各々のレーザビームに対して像面側で均一なビーム間隔と均一なビーム形状を得ることができるマルチビーム光源装置を提供すること。

【解決手段】 コリメートレンズ35は鏡筒6に接着あるいは圧入され納められており、鏡筒6は回転基体3の 嵌合孔3 b に光軸A方向に半導体レーザアレイ30との位置を合わせて接着あるいは図示しないネジ等により固定される。回転基体3に固定された鏡筒6は基体10の 嵌合孔10 a と勘合し、鏡筒6の外径6 a を回転中心として回動できるようになっている。一般にレンズ外径とレンズ光軸は精度良く偏芯は抑えられており、且つ鏡筒6の外径6 a とコリメートレンズ35の嵌合部6 b とは同一加工のため同軸精度が出ており、鏡筒6の外径の6 a の中心とコリメートレンズ35の光軸Aとは正確に一致することになる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一バッケージ内にアレイ状に等間隔の 複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源とし、こ れらの光源より発光された複数のレーザ光を各々平行光 束にするコリメートレンズを有するマルチビーム光源装 置において、

1

半導体レーザアレイの両端の発光点間の中央部とコリメ ートレンズの光軸とが一致するように移動調整する調整

前記コリメートレンズがコリメートレンズの光軸を中心 10 として回動自在としたことを特徴とするマルチビーム光 源装置。

【請求項2】 同一パッケージ内にアレイ状に等間隔の 複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源とし、こ れらの光源より発光された複数のレーザ光を各々平行光 束にするコリメートレンズを有するマルチビーム光源装 置において、

半導体レーザアレイの両端の発光点間の中央部とコリメ ートレンズの光軸とが一致するように移動調整する調整 手段を備え、

前記コリメートレンズが外筒部に収容されており、且つ コリメートレンズの光軸を中心として回動自在であり、 このコリメートレンズが収容された外筒部と係合する孔 を有する基体をさらに備え、

この回動は、この外筒部が基体の孔と嵌合摺動すること を特徴とするマルチビーム光源装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載のマルチ ビーム光源装置を備え、

複数のレーザ光を被走査面に走査する走査手段と、

この走査手段により走査される複数のレーザ光を被走査 30 面に結像させる結像手段とからなることを特徴とするマ ルチビーム走査装置。

【請求項4】 請求項3に記載のマルチビーム走査装置 を備え、このマルチビーム走査装置を用いて、画像デー タを出力することを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一走査にて複数ビ ームの光走査を行うためのマルチビーム光源装置、この 光源装置により走査を行うマルチビーム走査装置、およ 40 びマルチビーム走査装置を用いて画像形成を行うレーザ プリンタ、ディジタル複写機、ファクシミリ等の画像形 成装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、レーザプリンタやディジタル複写 機などの画像形成装置では、記録速度の高速化および記 録密度の高密度化の要求に対応して、複数のレーザビー ムで感光体の被走査面上を同時に走査するマルチビーム 走査装置が採用されている。このマルチビーム走査装置

メートし、副走査対応方向に互いに微小角度を持たせて 合成し、偏向手段を介し、結像光学系により被走査面上 に複数の光スポットとして結像し、一度に複数ラインを 走査する。との複数のレーザビームを持つ光源として は、複数の発光点を同一基板上にアレイ状に並べた半導 体レーザアレイが使用されている。例えば、特開平8~ 136841号公報記載の発明では、2ビームLDアレ イの第1の光路を回転部材の回転軸に調整し、第2の光 路は第1の光路を中心として回動する技術が開示されて いる。また、特開平9-26550号公報記載の発明で は、LDアレイの複数のビームの深度方向のバラツキ内 に所望のスポット位置を持つ技術が開示されている。さ らに、特開昭56-42248公報記載の発明では、複 数の発光部を持つ光源を光学レンズの光軸を中心として 回転可能として、ビームピッチを調整する技術が開示さ れている。

[0003]

20

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記特開平 8-136841号公報で提案されている方式では、第 1のレーザ光路を回動部材の回転中心に一致させ、第2 のレーザ光路は回動部材を回動することにより第1と第 2の走査間隔(画像密度間隔)を調整するとしている。 しかし、この従来方式ではその構成上、コリメートレン ズの光軸から第2のレーザ光路は第1のレーザ光路より 遠ざかってしまう。これにより被走査面上の第1と第2 のビームウェスト位置が異なってしまい、所望のビーム 径を得ることが困難である。また、2つ以上の発光点を もつ半導体レーザアレイでは、所望のビーム径を得ると とはより困難になり、さらなる記録速度の高速化および 記録密度の高密度化に対応できない。

【0004】一方で、コリメートレンズがコリメートレ ンズの光軸を中心として回動することにより、各々のレ ーザビームに対して像面側で均一なビーム間隔と均一な ピーム形状を得ることができるが、この場合は、コリメ ートレンズの光軸が一致するように構成部品の寸法精度 誤差を髙めることが必要になり部品コストが上昇する。 また、回動部材の構成部品が多くなると累積誤差も大き くなってしまう。との誤差が大きくなると回動時に被走 査面上でビーム位置がずれてしまい、それを補正するた めの調整が必要となり、ますますコストが上昇してしま

【0005】そとで、本発明の第1の目的は、等間隔の 複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源として、 両端の発光点間の中心あるいは略中心とコリメートレン ズの光軸を一致するように移動調整して、コリメートレ ンズの光軸を中心として回動自在としたことで、各々の レーザビームに対して像面側で均一なビーム間隔と均一 なビーム形状を得ることができるマルチビーム光源装置 を提供することである。本発明の第2の目的は、上記の は、複数の半導体レーザからの光ビームをそれぞれコリ 50 回動部材の嵌合摺動部をレンズ光軸と同軸精度の出しや

すいコリメートレンズのレンズ外筒とすることにより、 構成部品を少なくかつ精度良く回動するマルチビーム光 源装置を提供することである。

【0006】また、本発明の第3の目的は、上記のよう なマルチピーム光源装置を用い、被走査面上に所望の走 査間隔(画素密度間隔)および各々のレーザビームに対 して均一な所望のビーム径を得ることができるマルチビ ーム走査装置を提供することである。また、本発明の第 4の目的は、このマルチビーム走査装置を備え、画質を 損なうことなく速度の高速化および記録密度の高密度化 10 を得ることが可能な画像形成装置を提供することであ

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明で は、同一パッケージ内にアレイ状に等間隔の複数発光点 を有する半導体レーザアレイを光源とし、これらの光源 より発光された複数のレーザ光を各々平行光束にするコ リメートレンズとを有するマルチビーム光源装置におい て、半導体レーザアレイの両端の発光点の中央部とコリ メートレンズの光軸とが一致するように移動調整する調 整手段を備え、前記コリメートレンズの光軸を中心とし て回転自在としたことにより、前記第1の目的を達成す

【0008】請求項2記載の発明では、同一パッケージ 内にアレイ状に等間隔の複数発光点を有する半導体レー ザアレイを光源とし、これらの光源より発光された複数 のレーザ光を各々平行光束にするコリメートレンズを有 するマルチビーム光源装置において、半導体レーザアレ イの両端の発光点間の中央部とコリメートレンズの光軸 とが一致するように移動調整する調整手段を備え、前記 30 コリメートレンズが外筒部に収容されており、且つコリ メートレンズの光軸を中心として回動自在であり、この コリメートレンズが収容された外筒部と係合する孔を有 する基体をさらに備え、この回動は、この外筒部が基体 の孔と嵌合摺動することにより、前記第2の目的を達成

【0009】請求項3記載の発明では、請求項1または 請求項2に記載のマルチビーム光源装置を備え、複数の レーザ光を被走査面に走査する走査手段と、この走査手 段により走査される複数のレーザ光を被走査面に結像さ せる結像手段と具備したことにより、前記第3の目的を 達成する。

【0010】請求項4記載の発明では、請求項3に記載 のマルチビーム走査装置を備え、このマルチビーム走査 装置を用いて、画像データを出力することにより、前記 第4の目的を達成する。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態 を図1ないし図5を参照して詳細に説明する。図1は本

ある。このマルチビーム走査装置は、アレイ状の複数個 の光源を有する半導体レーザアレイ(半導体レーザダイ オードアレイ)30と、この半導体レーザアレイ30か らの複数個の光ビームを各々平行光束または略平行光束 にするコリメートレンズ35、副走査方向にパワーを有 するシリンダレンズ31、光ビームの偏向走査手段であ る回転多面鏡32、f θレンズ系33、トロイダルレン ズ34、反射鏡38、像担持体である感光体ドラム3 6、1走査毎の走査開始時を検知し、同期信号を得るた めの光検知器37とから構成されている。

【0012】まず、半導体レーザアレイ30から発光し た複数のレーザビームは、コリメートレンズ35によっ て平行光束あるいは略平行光束になり、シリンダレンズ 31を介して回転多面鏡32よりなる偏向走査手段に入 射される。そして、この回転多面鏡32を回転させると とにより、主走査方向に繰り返し走査されることにな る。回転多面鏡32で反射されたレーザビームは、結像 系であるf θレンズ33とトロイダルレンズ34により 収束光となり、反射鏡38により反射されて、ビームウ ェスト位置である結像位置に配置された感光体ドラム3 6等の被走査面39上に光スポットとして投影される。 このとき4つのレーザビームは、副走査方向(主走査方 向と直行する方向) に画素密度間隔Pだけ離れて4本の 走査線が一走査にて同時に書き込まれる。画素密度を6 0.0 dpi de 5 de P = 1 inch/600 = 42.3μmとなる。また、有効走査幅の領域外に光検知器37 を設けており、一走査毎の走査方向にレーザビームを検 知し同期を取っている。

【0013】図2は本実施の形態のマルチビーム光源装 置の構成例を示した図である。半導体レーザアレイ30 は、支持体2に圧入または密着、あるいは図示しない別 部材をネジ等で締結することにより固定されている。支 持体2は回転基体3の裏面3aにネジにて接合される。 ここで支持体2の孔はネジに対して遊びが存在するよう になっており、コリメートレンズ35の光軸Aに対して 半導体レーザアレイ30を上下左右に位置調整可能とな っている。

【0014】コリメートレンズ35は鏡筒6に納められ ており、鏡筒6は回転基体3の嵌合孔3bに光軸A方向 に半導体レーザアレイ30との位置を合わせて接着ある いは図示しないネジ等により固定されている。回転基体 3には嵌合孔3 b と同心の嵌合軸3 e があり、基体10 の嵌合孔10aと嵌合し、嵌合軸3eを回転中心として (これはコリメートレンズ35の光軸あるいは略光軸と 一致する)回動でき、光源装置の調整後にネジ11によ り基体10に固定保持される。回転基体3のボス3dに は半導体レーザアレイ30の駆動回路よりなる基板7が ネジ8にて固定されている。この光源装置は走査装置の 光学ハウジング12に位置決めピン12a、12bによ 実施の形態に係るマルチビーム走査装置の概略構成図で 50 り姿勢が、取付面12cにより定められた空間距離をも

って取り付けられる。

【0015】図3に半導体レーザアレイ30とコリメー トレンズ35との関係を、図4に結像位置でのビームス ポットの縦方向(副走査方向、画素密度間隔方向)の位 置を示してある。ことでは、調整方法を4つの光源を持 った例について説明する。等間隔に並んだ101、10 2、103、104のうち両端の101と104の中央 に、コリメートレンズ35の光軸Aが来るように、支持 体2を上下左右に位置調整し固定する。これにより、各 々の光源101、102、103、104からコリメー トレンズ5までの距離X1、X2、X3、X4がほぼ等 しくなる。光源間隔 p は数十µmほどの微少間隔である ので、すべてのレーザビームが光軸A近傍を通ることに なり、結像位置での各々のビーム径Dと画素密度間隔P はほぼ均一となる。この状態で回転基体3を回動すると 略光軸Aを中心に回動し、画素密度間隔はPより狭まり P'となるのでPを所望の画素密度間隔より大きくなる ように、結像系の副走査倍率を決定しておけば、容易に 所望の画素密度間隔を得ることができる。

【0016】また、各々の光源間の中心付近にて回動するため、回動によりビーム位置が大きく異なったりするとともなく、非常に安定し、精度良く合わせるととが可能となる。この回動により画素密度 P'を調整する際に、この光源装置を調整治具にて回動位置を合わせておけば、光源装置のユニットでの互換性を保つことができる。

【0017】 この回動位置の位置決めは、基体10に設けられた位置決め孔10b、10cにより行われる。すなわち光学ハウジング12と図示しない調整治具とで、レーザビームの結像位置よりみて同じ位置に基体10が30配置するようにすれば良い。これにより市場等で光源装置を交換することになっても調整することなく交換ができるようになる。なお、上記例では、半導体レーザアレイ30の位置を調整する例を説明したが、コリメートレンズ35の位置を調整するようにしてもよい。

【0018】次に、図5を参照して第2の実施の形態を説明する。この第2の実施の形態を説明するにあたり、第1の実施の形態と同様の箇所は、説明を省略し、相違点のみ以下に述べる。図5に示すように、コリメートレンズ35は鏡筒6に接着あるいは圧入され納められており、鏡筒6は回転基体3の嵌合孔3bに光軸A方向に半導体レーザアレイ30との位置を合わせて接着あるいは図示しないネジ等により固定される。回転基体3に固定された鏡筒6は基体10の嵌合孔10aと勘合し、鏡筒6の外径6aを回転中心として回動できるようになっている。一般にレンズ外径とレンズ光軸は精度良く偏芯は抑えられており、且つ鏡筒6の外径6aとコリメートレンズ35の嵌合部6bとは同一加工のため同軸精度が出ており、鏡筒6の外径の6aの中心とコリメートレンズ35の光軸Aとは正確に一致することになる。この回転50

基体3は後述の光源装置の調整後にネジ11により基体10により固定保持される。

[0019]

【発明の効果】請求項1記載の発明では、同一バッケージ内にアレイ状に等間隔の複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源として、両端の発光点間の中心あるいは略中心とコリメートレンズの光軸を一致するように移動調整して、コリメートレンズの光軸あるいは略光軸を中心として回動自在としているので、各々のレーザビームに対して像面側で均一なビーム間隔と均一なビーム形状を得ることができる。

【0020】請求項2記載の発明では、同一バッケージ内にアレイ状に等間隔の複数発光点を有する半導体レーザアレイを光源として、両端の発光点間の中心あるいは略中心とコリメートレンズの光軸を一致するように移動調整して、コリメートレンズのレンズ外筒部にて嵌合摺動させ光軸を中心として回動自在としているので、低コストで精度良く各々のレーザビームに対して像面側で回動による位置ズレが少ない均一なビーム形状を得ることができる。

【0021】請求項3記載の発明では、請求項1または 請求項2に記載のマルチビーム光源装置と複数のレーザ 光を被走査面に走査する走査手段と、走査されるレーザ 光を被走査面に結像させる結像部を有しているので、被 走査面上に所望の走査間隔(画素密度間隔)および各々 のレーザビームに対して均一所望のビーム径を得ること ができる。

【0022】請求項4記載の発明では、請求項3に記載のマルチビーム走査装置を備えているので、画質を損な うことなく速度の高速化と高密度化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態に係るマルチビーム走査装置の概略構成図である。

【図2】第1の実施の形態に係るマルチビーム光源装置 の構成例を示す図である。

【図3】半導体レーザアレイとコリメートレンズとの関係を示した図である。

【図4】結像位置でのビームスポットの縦方向(副走査方向、画素密度間隔方向)の位置を示した図である。

0 【図5】第2の実施の形態に係るマルチビーム光源装置 の構成例を示す図である。

【符号の説明】

- 2 支持体
- 3 回転基体
- 6 鏡筒
- 10 基体
- 12 光学ハウジング
- 30 半導体レーザアレイ
- 31 シリンダレンズ
- 32 回転多面鏡

8

33 fθレンズ

34 トロイダルレンズ

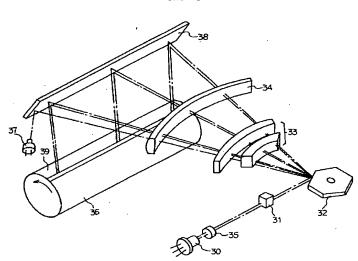
35 コリメートレンズ36 感光体ドラム

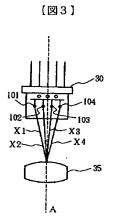
*37 光探知器 38 反射鏡

39 被走查面

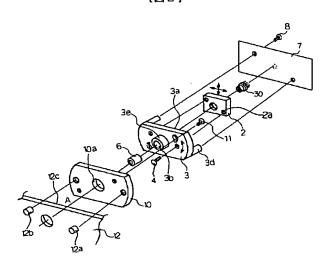
*

【図1】

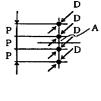




【図2】



【図4】





【図5】

